

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 9 月 9 日 (09.09.2005)

PCT

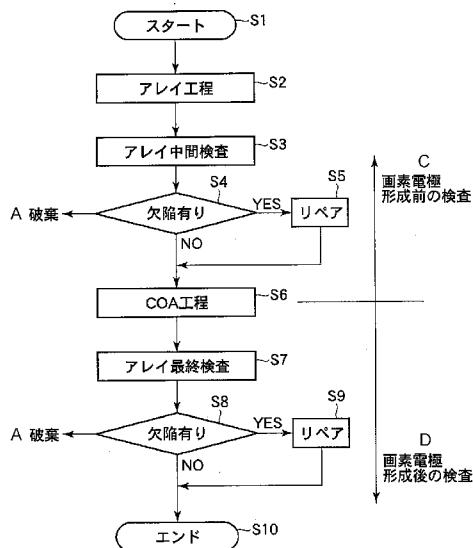
(10) 国際公開番号
WO 2005/083452 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G01R 31/00
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/002814
- (22) 国際出願日: 2005 年 2 月 22 日 (22.02.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2004-054894 2004 年 2 月 27 日 (27.02.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社 (TOSHIBA MATSUSHITA DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1080075 東京都港区港南四丁目 1 番 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 富田 暁 (TOMITA, Satoru) [JP/JP].
- (74) 代理人: 鈴江 武彦, 外 (SUZUYE, Takehiko et al.); 〒1000013 東京都千代田区霞が関 3 丁目 7 番 2 号 鈴榮特許総合事務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NL, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,

[続葉有]

(54) Title: METHOD FOR INSPECTING ARRAY BOARD AND METHOD FOR MANUFACTURING ARRAY BOARD

(54) 発明の名称: アレイ基板の検査方法およびアレイ基板の製造方法



(57) Abstract: In the case of inspecting an array board, whether a defect exists in the array board is inspected prior to providing a pixel electrode (step (S3)), and after providing the pixel electrode (step (S7)).

(57) 要約: アレイ基板を検査する場合、画素電極を設ける前のアレイ基板の欠陥の有無を検査し (ステップ S3)、画素電極が設けられた後のアレイ基板の欠陥の有無を検査する (ステップ S7)。

S1 ...START
S2 ...ARRAY PROCESS
S3 ...ARRAY INTERMEDIATE INSPECTION
S4 ...DEFECT EXISTS
A ...DISCARD
S5 ...REPAIR
S6 ...COA PROCESS
S7 ...ARRAY FINAL INSPECTION
S8 ...DEFECT EXISTS
S9 ...REPAIR
S10 ...END
C ...INSPECTION PRIOR TO PIXEL ELECTRODE FORMATION
D ...INSPECTION AFTER PIXEL ELECTRODE FORMATION



IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書